

PSS CHIP12806

可见光 CHIP 测试机 ▶▶▶



产品简介

本设备应用于可见光 CHIP 常温 PIV 测试、光谱测试并对不同测试结果进行归类分档筛选。芯片蓝膜上料，自动寻料、识别定位，通过蓝膜顶针剥离芯片、吸嘴吸取、机械手完成搬运，视觉识别并校准位置、自动加电收集发光参数、测试 PIV/光谱、分析筛选、机械手搬运分档到不同蓝膜档位。

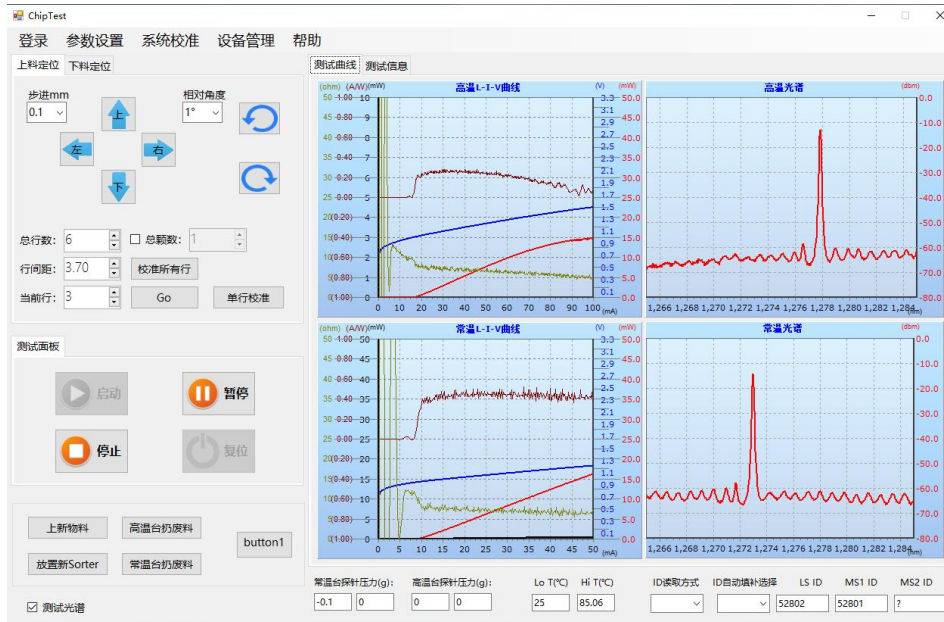
此设备具有高速、高精度特点，实现了复杂时序、严密逻辑的工艺流程。设备采用了直线电机、高精度模组运动、凸轮等机构，配合多轴运动、视觉定位、ORC 识别等技术，具有批量生产能力。

产品应用

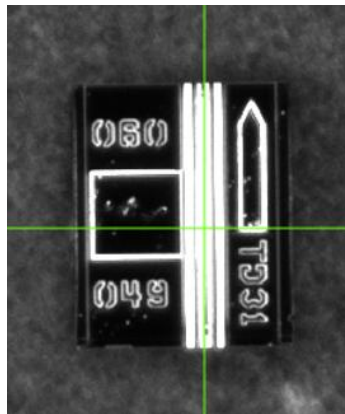
- 设备用于可见光裸 chip 自动测试分 bin，可以实现常温、高温条件下边发射芯片的光谱、LIV 参数测试

产品特点

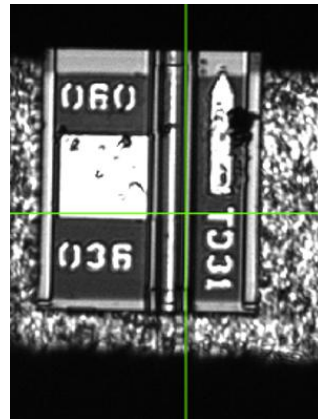
- 支持 Chip 的 LIV、光谱相关参数的测试、绘制测试曲线



- 芯片蓝膜自动上料, 通过视觉系统自动识别芯片 ID, 测试台支持芯片在相机下自动二次定位, 精准控制探针加电测试



上料相机对焦



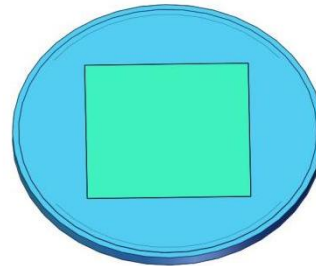
测试台相机对焦

- 探针自动下压加电, 探针下压力度可调, 支持探针力度实时显示

- 下料配置 8 个蓝膜盘、4 个 2 寸 GelPak 盒

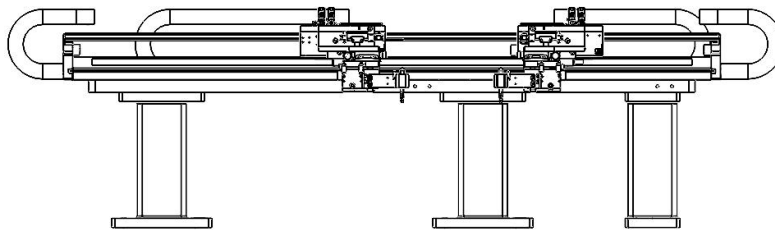


2 寸真空释放盒

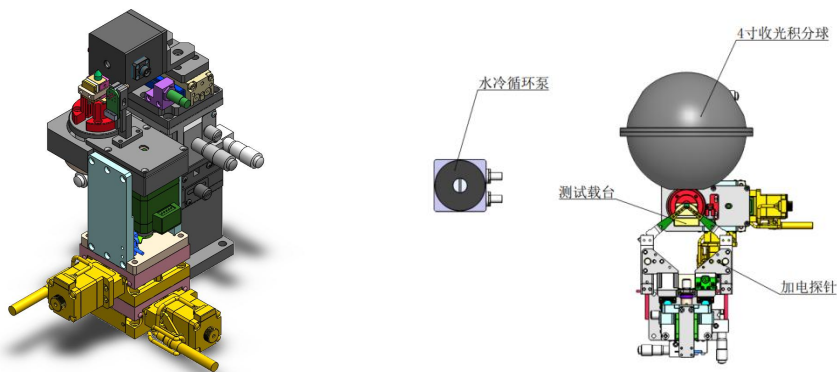


6 寸蓝膜环

- 拾取搬运机构（上料吸嘴、下料吸嘴组成，搬运轴采用高精度直线电机控制），稳定性好，运动精度高



- 可实现小功率测试和大功率测试：小功率测试系统（风冷+TEC 控温；1 寸积分球收光，测 PIV、光谱），（预留）大功率测试系统（水冷+TEC 控温；3 寸积分球收光，测 PIV、光谱）



■ 技术参数

参 数	指 标
适合芯片尺寸	腔长 L x 宽 W : 200-2000 μm x 120-300 μm 其他尺寸可定制测试载台
仪表型号	吉时利 (Keithley) 2601B-PULSE
测量参数	LIV 曲线, Ith, Po, Vf, Im, Rs, SE, Kink 等
LD 驱动电流	小功率芯片范围 0 ~ 300mA, 精度 0.1%FS \pm 0.5mA 大功率芯片范围 0 ~ 5A, 精度 0.1%FS \pm 5mA
电流模式	CW/Pulse
P-I-V	Pulse 0.1ms (ON) Duty1%
正向电压测试	小功率芯片范围 0 ~ 15.0V, 精度 0.1% FS \pm 50mV 大功率芯片范围 0 ~ 10.0V, 精度 0.1% FS \pm 50mV
反向电流测试	0 ~ 100nA, 精度 1% FS \pm 1.0nA, @<50%RH 0 ~ 1 μ A, 精度 0.1% FS \pm 10nA, @<50%RH 0 ~ 10 μ A, 精度 0.1% FS \pm 0.1 μ A, @<50%RH 0 ~ 100 μ A, 精度 0.1% FS \pm 1 μ A, @<50%RH 0 ~ 1mA, 精度 0.1% FS \pm 10 μ A, @<50%RH
反向电压测试	范围 0 ~ 30.0V, 精度 0.1% FS \pm 0.3V
光功率测试	小功率芯片测试范围 0-300mW; 精度 0.1% FS \pm 50 μ W; 波长范围 380-700nm 大功率芯片测试范围 0-10W; 精度 0.1% FS \pm 10mW; 波长范围 380-700nm
温度控制	常温:20~85 $^{\circ}$ C; 稳定性 \leq \pm 0.5 $^{\circ}$ C
设备尺寸	最大展开尺寸: 2050mm \times 1800mm \times 2090mm(L \times W \times H)
气源要求	正压: >0.6MPa 负压: <-80KPa
电源	AC 220V/8A 50Hz